

СОДЕРЖАНИЕ

Том 75, № 1, 2011

Материалы Международного симпозиума “Нанофизика и наноэлектроника-2010”

В. Н. Трушин, А. С. Маркелов, Е. В. Чупрунов	
Термоиндукционное управление дисперсионными свойствами кристаллов	6
Р. Ф. Мамин, Д. А. Бизяев, А. А. Бухараев	
Локально-индукционные заряженные поляризационные состояния в мanganитах	10
И. М. Маловичко, А. Ю. Осташенко, С. И. Леесмент	
Применение фазокомпенсирующего метода обратной динамики для увеличения скорости сканирования зондового микроскопа	14
Д. О. Филатов, Д. А. Антонов, С. Ю. Зубков, А. В. Нежданов, А. И. Машин	
Структура и свойстваnanoструктур Si на поверхности высокоориентированного пиролитического графита	18
И. А. Карпович, О. Е. Хапугин, Е. А. Горбачева	
Фотомагнитный эффект в гетеронаноструктурах с квантовой ямой InGaAs/GaAs и дельта-слоем Mn	23
И. А. Карпович, Л. А. Истомин	
Динамический эффект поля в легированных дельта-слоем Mn гетеронаноструктурах с квантовой ямой и квантовыми точками In(Ga)As/GaAs	27
А. В. Здоровейщев, Н. В. Байдусь, Б. Н. Звонков, П. Б. Демина	
Управление самоорганизацией массива квантовых точек InAs при росте методом газофазной эпитаксии на δ-легированном сурьмой буферном слое GaAs	31
С. А. Гусев, Б. А. Грибков, М. Н. Дроздов, В. Н. Петров, Е. В. Скороходов	
О подготовке поверхности при диагностике магнитных структур	34
Д. В. Рощупкин, Д. В. Иржак, А. А. Снигирев, И. И. Снигирева	
Рентгеновская оптика в ИПТМ РАН	39
В. И. Пунегов, Н. Н. Фалеев	
Рассеяние рентгеновских лучей на многослойных структурах с квантовыми точками	42
Ю. Н. Дроздов, М. Н. Дроздов, А. В. Новиков, П. А. Юнин, Д. В. Юрасов	
Прямое сравнение периодов сверхрешеток, измеренных методом рентгеновской дифрактометрии и оптической интерферометрии	45
Н. Н. Салащенко, Н. И. Чхало	
Проект изготовления российского ЭУФ-нанолитографа для производства СБИС по технологическим нормам 22 нм	49
Д. Г. Волгунов, И. Г. Забродин, Б. А. Закалов, С. Ю. Зуев, И. А. Каськов, Е. Б. Клюенков, А. Е. Пестов, В. Н. Полковников, Н. Н. Салащенко, Л. А. Суслов, М. Н. Торопов, Н. И. Чхало	
Стенд проекционного ЭУФ-нанолитографа-мультиплексора с расчетным разрешением 30 нм	54
С. Ю. Зуев, Е. Б. Клюенков, А. Е. Пестов, В. Н. Полковников, Н. Н. Салащенко, Л. А. Суслов, М. Н. Торопов, Н. И. Чхало	
Технологический комплекс для изготовления прецизионной изображающей оптики	57
С. Ю. Зуев, А. Е. Пестов, Н. Н. Салащенко, А. С. Скрыль, И. Л. Струля, Л. А. Суслов, М. Н. Торопов, Н. И. Чхало	
Двухзеркальный проекционный объектив нанолитографа на $\lambda = 13.5$ нм	61
Ю. А. Вайнер, М. В. Зорина, А. Е. Пестов, Н. Н. Салащенко, Н. И. Чхало, Р. А. Храмков	
Развитие микрошероховатости поверхности плавленого кварца и покрытий Cr/Sc при травлении ионными пучками	65
А. В. Водопьянов, С. В. Голубев, Д. А. Мансфельд, Н. Н. Салащенко, Н. И. Чхало	
Источник экстремального ультрафиолетового излучения на основе плазмы, нагреваемой излучением миллиметрового диапазона	68

М. М. Барышева, Ю. А. Вайнер, Б. А. Грибков, М. В. Зорина, А. Е. Пестов, Д. Н. Рогачев, Н. Н. Салащенко, Н. И. Чхало	71
Особенности изучения шероховатости подложек для многослойной рентгеновской оптики методами малоугловой рентгеновской рефлектометрии, атомно-силовой и интерференционной микроскопии	
М. Н. Дроздов, Е. Б. Клюенков, А. Я. Лопатин, В. И. Лучин, А. Е. Пестов, Н. Н. Салащенко, Н. Н. Цыбин, Н. И. Чхало, Л. А. Шмаенок	77
Термически стойкие многослойные фильтры на основе молибдена для экстремального УФ-диапазона	
М. Н. Дроздов, Ю. Н. Дроздов, Е. Б. Клюенков, А. Я. Лопатин, В. И. Лучин, Н. Н. Салащенко, Н. Н. Цыбин, Л. А. Шмаенок	80
Эволюция распределения элементов в свободно висящих структурах Zr/ZrSi ₂ с защитными слоями MoSi ₂ и ZrSi ₂ при отжиге	
С. Ю. Зуев, А. В. Митрофанов	84
Зеркальные свойства поверхности химически травленных пленок полиэтилентерефталата в мягкой рентгеновской области	
С. В. Кузин, В. Н. Полковников, Н. Н. Салащенко	88
Выбор материалов оптики для диагностики атмосферы Солнца в диапазоне длин волн 6–60 нм	
С. В. Кузин, С. А. Богачев, А. А. Перцов, С. В. Шестов, А. А. Рева, А. С. Ульянов	91
Исследование солнечной короны со сверхвысоким пространственным разрешением в проекте “АРКА”	
В. А. Слемзин	95
Фотометрия солнечного ВУФ-излучения с помощью космических телескопов с многослойной оптикой нормального падения	
А. А. Ахсалян, А. Д. Ахсалян, М. В. Зорина, А. И. Харитонов	102
Методика измерений формы поверхности вращения на интерференционном микроскопе “Talysurf CCI 2000”	
М. Н. Дроздов, Ю. Н. Дроздов, М. М. Барышева, В. Н. Полковников, Н. И. Чхало	106
Послойный анализ многослойных металлических структур Pd/B ₄ C, Ni/C, Cr/Sc методом ВИМС с использованием кластерных вторичных ионов: проблема повышения разрешения по глубине	
 Материалы XII Всероссийского семинара “Волновые явления в неоднородных средах”	
С. В. Сазонов	112
Фотонное эхо на комбинационно-активных переходах	
В. И. Горбачев	117
Динамические задачи механики композитов	
А. Н. Голубятников	123
Обобщенная потенциальность течений неоднородных сред	
К. В. Дмитриев, И. В. Кортунов	128
Эффект сокрытия рассеивателя акустическими дважды отрицательными средами	
А. В. Аксенов	134
Нелинейная эволюция периодических возмущений в газе	
В. С. Юшутин	139
Вязкопластические течения по каналам с переменным по длине сечением и деформируемыми стенками	
А. К. Бабушкин, А. С. Бугаев, А. В. Вартанов, А. В. Корженевский, С. А. Сапецкий, Т. С. Туйкин, В. А. Черепенин	144
Разработка методов и инструментов магнитоиндукционной томографии для изучения мозга и когнитивных функций человека	
Д. В. Георгиевский	149
Обобщенные оценки Джозефа устойчивости плоских сдвиговых течений со скалярной нелинейностью	

Contents

Vol. 75, No. 1, 2011

A simultaneous English language translation of this journal is available from Allerton Press, Inc.
Distributed worldwide by Springer. *Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics* ISSN 1062-8738.

Symposium “Nanophysics and Nanoelectronics-2010”

V. N. Trushin, A. S. Markelov, E. V. Chuprunov

Thermo-induced control of dispersion properties of the crystals

6

R. F. Mamin, D. A. Bizyaev, A. A. Bukharaev

Locally induced charged polar states in manganites

10

I. M. Malovichko, A. Y. Ostashenko, S. I. Leesment

Phase compensating inverse-dynamics method for high-speed AFM imaging

14

D. O. Filatov, D. A. Antonov, S. Yu. Zubkov, A. V. Nezhdanov, A. I. Mashin

The structure and properties of the Si nanostructures on highly oriented pyrolytic graphite

18

I. A. Karpovich, O. E. Khapugin, E. A. Gorbachova

The photomagnetic effect in Mn delta-doped heteronanostructures with a quantum well InGaAs/GaAs

23

I. A. Karpovich, L. A. Istomin

Dynamic field effect in Mn delta-doped quantum well and quantum dot heteronanostructures
In(Ga)As/GaAs

27

A. V. Zdrovovishev, N. V. Baidus, B. N. Zvonkov, P. B. Demina

Control of self-organization of InAs quantum dots at growth by vapor-phase epitaxy
on antimony δ-doped GaAs buffer layer

31

S. A. Gusev, B. A. Gribkov, M. N. Drozdov, V. N. Petrov, E. V. Skorohodov

Preparation of surface for investigation of magnetic structure

34

D. V. Roshchupkin, D. V. Irzhak, A. A. Snigirev, J. I. Snigireva

X-ray optics in IMT RAS

39

V. I. Punegov, N. N. Faleev

X-ray scattering in multilayer structures with quantum dots

42

Yu. N. Drozdov, M. N. Drozdov, A. V. Novikov, P. A. Yunin, D. V. Yurasov

Direct comparison of superlattice periods measured with X-ray diffractometry and optical interferometry

45

N. N. Salashchenko, N. I. Chkhalo

A project of creation of the Russian EUV-nanolithographer for manufacturing chips with
a topology of 22 nm

49

**D. G. Volgunov, I. G. Zabrodin, B. A. Zakalov, S. Yu. Zuev, I. A. Kas'kov, E. B. Kluenkov,
A. E. Pestov, V. N. Polkovnikov, N. N. Salashchenko, L. A. Suslov, M. N. Toropov, N. I. Chkhalo**

A stand of a projective EUV nanolithographer – multiplicator with designed resolution of 30 nm

54

**S. Yu. Zuev, E. B. Kluenkov, A. E. Pestov, V. N. Polkovnikov, N. N. Salashchenko,
L. A. Suslov, M. N. Toropov, N. I. Chkhalo**

Technological complex for manufacturing precise imaging optics

57

**S. Yu. Zuev, A. E. Pestov, N. N. Salashchenko, A. S. Skryl, I. L. Stroulea, L. A. Suslov,
M. N. Toropov, N. I. Chkhalo**

Two-mirror projection objective of a nanolithographer on the $\lambda = 13.5$ nm

61

**Yu. A. Vainer, M. V. Zorina, A. E. Pestov, N. N. Salashchenko, N. I. Chkhalo,
R. A. Khramkov**

The evolution of roughness of surfaces of Cr/Sc multilayer structures and amorphous quartz
by ion-beam etching

65

A. V. Vodopyanov, S. V. Golubev, D. A. Mansfeld, N. N. Salashchenko, N. I. Chkhalo

Extreme-ultraviolet source based on microwave heated plasma

68

**M. M. Barysheva, Yu. A. Vainer, B. A. Gribkov, M. V. Zorina, A. E. Pestov,
D. N. Rogachev, N. N. Salashchenko, N. I. Chkhalo**

Peculiarities of application small-angle X-ray reflectometry, atomic force and interferential
microscopy techniques for surface roughness study of substrates for multilayered X-ray optics

71

M. N. Drozdov, E. B. Kluenkov, A. Ya. Lopatin, V. I. Luchin, A. E. Pestov, N. N. Salashchenko, N. N. Tsybin, N. I. Chkhalo, L. A. Shmaenok	77
Mo-based EUV multilayer filters with enhanced thermal stability	
M. N. Drozdov, Yu. N. Drozdov, E. B. Kluenkov, A. Ya. Lopatin, V. I. Luchin, N. N. Salashchenko, N. N. Tsybin, L. A. Shmaenok	
Evolution of elemental distribution in freestanding structures Zr/ZrSi ₂ with protective coating MoSi ₂ and ZrSi ₂ under annealing	80
S. Yu. Zuev, A. V. Mitrofanov	
Specular properties of chemical etched polyethylene terephthalate films in the soft X-ray range	84
S. V. Kuzin, V. N. Polkovnikov, N. N. Salashchenko	
Selection of optics materials for diagnostics of solar atmosphere in wave-length range 6–60 nm	88
S. V. Kuzin, S. A. Bogachev, A. A. Pertsov, S. V. Shestov, A. A. Reva, A. S. Ul'yanov	
XUV observations of solar corona with superhigh spatial resolution in the ARCA project	91
V. A. Slemzin	
Photometry of solar EUV radiation with the using the space-based telescopes with normal incidence multilayer-coated optics	95
A. A. Akhsakhalyan, A. D. Akhsakhalyan, M. V. Zorina, A. I. Kharitonov	
The method of measurement of rotation surface shape by the interference microscope “Talysurf CCI 2000”	102
M. N. Drozdov, Yu. N. Drozdov, M. M. Barysheva, V. N. Polkovnikov, N. I. Chkhalo	
SIMS depth profiling of metal multilayers Pd/B ₄ C, Ni/C, Cr/Sc with cluster secondary ions registration: the problem of depth resolution enhancement	106
 Materials of XII All-Russian seminar “The wave phenomena in inhomogeneous media”	
S. V. Sazonov	
Photon echo on the Raman transitions	112
V. I. Gorbachev	
Dynamical problems of mechanics of composites	117
A. N. Golubiatnikov	
Generalized potentiality of inhomogenous media flows	123
K. V. Dmitriev, I. V. Kortunov	
The effect of scatterer hiding with acoustical double negative media	128
A. V. Aksenov	
Nonlinear evolution of periodic gas perturbations	134
V. S. Yushutin	
Viscoplastic flow in channels with variable cross-section and deformable walls	139
A. K. Babushkin, A. S. Bugaev, A. V. Vartanov, A. V. Korjenevsky, S. A. Sapetskiy, T. S. Tuykin, V. A. Cherepenin	
Developing of methods and instruments of electromagnetic tomography for studying human brain and cognitive functions	144
D. V. Georgievskii	
The generalized Joseph estimates for stability of plane shear flows with a scalar non-linearity	149